



光学素子及び光学システムの干渉測定－ 表面形状及び波面形状公差の用語及び定義

JIS B 0091 : 2010

(ISO 14999-4 : 2007)

(JOIA/JSA)

平成 22 年 5 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 計測計量技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	田 中 充	独立行政法人産業技術総合研究所
(委員)	生 田 一 男	社団法人日本計量機器工業連合会
	石 崎 法 夫	独立行政法人製品評価技術基盤機構
	市 原 裕	株式会社ニコン
	大 園 成 夫	東京電機大学
	河 野 嗣 男	東京都立科学技術大学名誉教授
	秦 康 之	環境省
	前 田 哲 也	日本精密測定機器工業会
	吉 原 順 二	社団法人日本電気計測器工業会
(専門委員)	野 原 慈 久	財団法人日本規格協会

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 22.5.20

官 報 公 示：平成 22.5.20

原 案 作 成 者：日本光学工業協会

(〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 TEL 03-3431-7073)

財団法人日本規格協会

(〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571)

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会 (部会長 二瓶 好正)

審議専門委員会：計測計量技術専門委員会 (委員長 田中 充)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット産業基盤標準化推進室 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文.....	1
1 適用範囲.....	1
2 引用規格.....	1
3 用語及び定義.....	1
3.1 数学的定義.....	2
3.2 光学関数の定義.....	2
3.3 3.2 で定義した光学関数に関連する値の定義.....	3
4 干渉計測と表面形状偏差又は透過波面形状との関係.....	5
4.1 被検領域.....	5
4.2 量（大きさ）.....	5
4.3 シングルパス（片道）透過波面.....	5
4.4 ダブルパス（往復）透過波面.....	5
4.5 表面形状偏差.....	5
4.6 他波長への変換.....	5
附属書 A（規定）視覚的方法による干渉図形解析.....	6
解 説.....	15

まえがき

この規格は、工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき、日本光学工業協会（JOIA）及び財団法人日本規格協会（JSA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について、責任はもたない。

光学素子及び光学システムの干渉測定— 表面形状及び波面形状公差の用語及び定義

Interferometric measurement of optical elements and systems— Terms and definitions of surface form and wavefront deformation tolerances

序文

この規格は、2007 年に第 1 版として発行された **ISO 14999-4** を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

この規格は、**JIS B 0090** 規格群で使用される光学素子及び光学システムの公差の中で、干渉測定に関する用語及び定義について規定する。この規格は、光学素子及び光学システム用の製図手法における光学関数の定義についても規定する。**附属書 A** は、視覚的解析方法による干渉じま評価のための手引きとして、**JIS B 0090-5** 及び／又は **JIS B 0090-14** に準拠している。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 14999-4:2007, Optics and photonics—Interferometric measurement of optical elements and optical systems—Part 4: Interpretation and evaluation of tolerances specified in ISO 10110 (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、**ISO/IEC Guide 21-1** に基づき、“一致している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS B 0090-5 光学素子及び光学システム用の製図手法—第 5 部：表面形状公差

注記 対応国際規格：**ISO 10110-5:2007**, Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 5: Surface form tolerances (IDT)

JIS B 0090-14 光学素子及び光学システム用の製図手法—第 14 部：波面形状公差

注記 対応国際規格：**ISO 10110-14:2007**, Optics and photonics—Preparation of drawings for optical elements and systems—Part 14: Wavefront deformation tolerance (IDT)

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。